

One Parameter に関する  
k-Dimensional Sampling Inspection

(10月30日受付)

東京繊維専門学校

成田 祐

製品の各個体のある一つの特性を数量的に表示し得る場合、仕切における分布のある一つの Parameter  $\theta$  のみを対象とし、 $\theta$  の大小を標本検査から推定して仕切の合格不合格を決定する問題と取扱ふ。特別な場合として仕切の不良箇數に関する問題にも應用し得る。

標本検査方式は次の条件を満足せしめるものとする。

- (I) 第一次検査に依つて 合格、不合格、保留を區別する。保留となつた仕切のみ第二次検査を施行する。以下各検査における標本が互に独立且つ任意に抽出したものと假定し得る範圍で第長次検査まで續行するものとする。
- (II)  $\theta_M$  より大なる parameter を有する仕切を不合格とする確率を  $\epsilon$  以下におさへる。  $\theta_M$  を Maximum Allowable Parameter in a lot と云ふ。
- (III)  $\bar{\theta}$  より小なる parameter を有する仕切を不合格とする確率を  $\alpha$  以下におさへる。  $\bar{\theta}$  を Process Average Parameter in a lot と云ふ。
- (IV)  $\theta$  に関して均齊性であるとの假説が捨てられるやうな標本系列を得た場合は、品質管理

不良とみなして、危険率  $\beta$  で不合格とする。  
 尚  $\theta$  (最適)統計量を  $T_i$  とし、ある与へられた  $\theta$  に対して、 $T_i$  の分布は標本の大きさ  $n_i$  が与へられ、これ によつて定まるものとする。即ち

$$F_i(\xi_i) = \int_{-\infty}^{\xi_i} dF_i(T_i | \theta, n_i) \text{ に依つて表示される}$$

とする。更に Stieltjes

積分を考へてゐる。尚  $i = 1, 2, \dots, k$ .

各標本検査は独立と考へられるから、 $T_i$  を直交座標軸とする  $k$ -dimensional space に  $F_i$  の  $k$ -variate distribution function が考へられる。

$$\begin{aligned} F(\xi_1, \dots, \xi_k) &= P_n(T_1 \leq \xi_1, \dots, T_k \leq \xi_k) \\ &= \int_{-\infty}^{\xi_1} \dots \int_{-\infty}^{\xi_k} dF_1 \dots dF_k \\ &= \prod_{i=1}^k P_n(T_i \leq \xi_i) \\ &= \int_{-\infty}^{\xi_1} dF_1 \dots \int_{-\infty}^{\xi_k} dF_k \\ &= \int_0^{\xi_k} dF_k = \prod_{i=1}^k \int_{-\infty}^{\xi_k} dF_i \end{aligned}$$

$F$  は cumulative distribution function の性質を挿入するものとす。

よて上記の4条件を満足する検査方式を構成するには次の法則に従つて合格、不合格を定めなければならぬ。積極的に合格、不合格が定められぬときは検査回数を増加してゆく。

◎ 法則 A

第  $j$  次検査後 検査値  $(t_1, \dots, t_j)$  が次の領域に落ちるときは第  $(j+1)$  次検査をすることなく合格とする。

$F(\xi_1, \dots, \xi_j) < \epsilon$  但し  $j \leq k$   
 尚  $F(\xi_1, \dots, \xi_j) = \epsilon$  を満足する  $\xi_1, \dots, \xi_j$  に依って得られる曲面を第  $j$  次検査における合格曲面と稱し  $j$  個の漸近面を有する。この漸近面は  $t_i = \xi_i$  にて表はされ  $\xi_i$  は次の式を満足するやうな値である。(合格曲面は漸近面と  $+\infty$  において出会う。)

$$F(\xi_1, +\infty, \dots, +\infty) = \epsilon$$

$$F(+\infty, +\infty, \dots, \xi_j, \dots, +\infty) = \epsilon$$

爰に  $F_i(t_i)$  に就いては  $G_i$  が与へられておるものとする。

◎ 法則 B

第  $j$  次検査後 検査値  $(t_1, \dots, t_j)$  が次の領域に落ちるときは第  $(j+1)$  次検査をすることなく不合格とする。

$1 - F(\eta_1, \dots, \eta_j) \leq \alpha$  但し  $j \leq k$   
 尚  $1 - F(\eta_1, \dots, \eta_j) = \alpha$  を満足する  $\eta_1, \dots, \eta_j$  に依って得られる曲面を第  $j$  次検査における不合格曲面と稱し  $j$  個の漸近面を有する。この漸近面は  $t_i = \eta_i$  にて表はされ  $\eta_i$  は次の式を満足するやうな値である。(不合格曲面は漸近面と  $-\infty$  において出会う。)

$$1 - F(+\infty, +\infty, \dots, \eta_j, \dots, +\infty, +\infty) = \alpha$$

爰に  $F_i(t_i)$  に就いては  $G_i$  が与へられておるものとする。

◎ 法則 C

法則 A に依り合格せる仕切りについて高目系列の均斉性に関し、危険率  $\beta$  は  $\epsilon$  と検査を  $k$  回である。

一般に、合格曲面と不合格曲面とは、先ず(II)と偏  
致しなるやうな合格曲面と不合格曲面を成可く  
足すに近づけざるやうな工場の要求もな  
一般に、消費者側は、ベクトル統計量へも  
一意に考へる。即ち2以上特性の場合へも  
本検査方式は、2以上特性の場合へも擴張  
来る。即ち2以上特性の場合へも擴張  
ある。

断るまでも無いのであるが、目標となる *parameter*  
が平均値の場合には尤一分布を、分散の場合には  
 $\chi^2$  一分布を利用する。(勿論正規型と假定しての場  
合であるが)。

不良箇数の標本検査には *Poisson* 分布、二項分布  
を用ひる。  
又平均値 *Vector* の検査には尤一分布を用ひれば好  
いと思ふ。

終りに種々と御懇切な注意を頂いた増山、小川  
坂元、各所の方から感謝致して居ります。豫定で  
尚、实例に就ては、何れ繊維学会誌に発表する  
ある。多くの御批判を頂いて、完全な検査方式  
成る事を心から切望してゐる次第である。